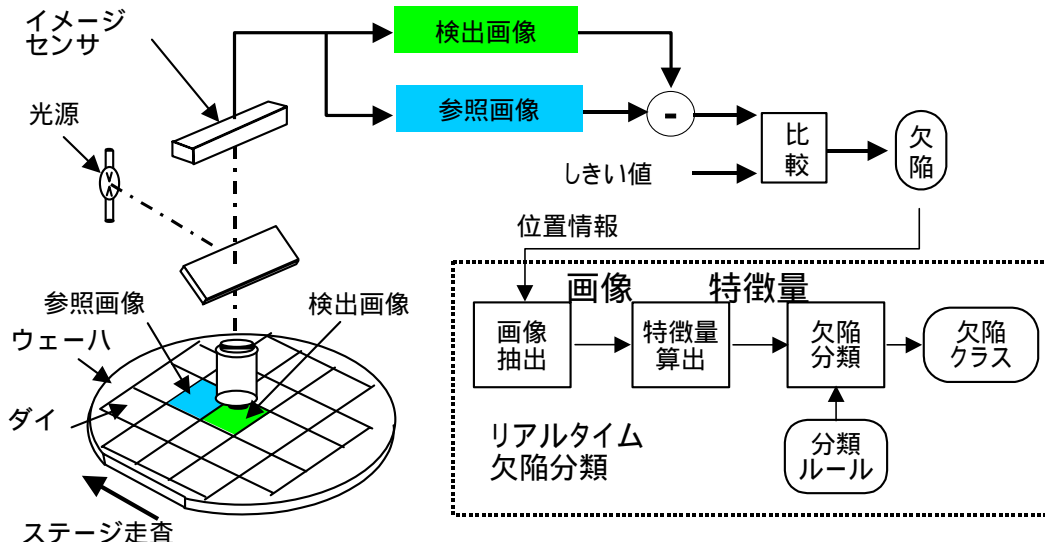
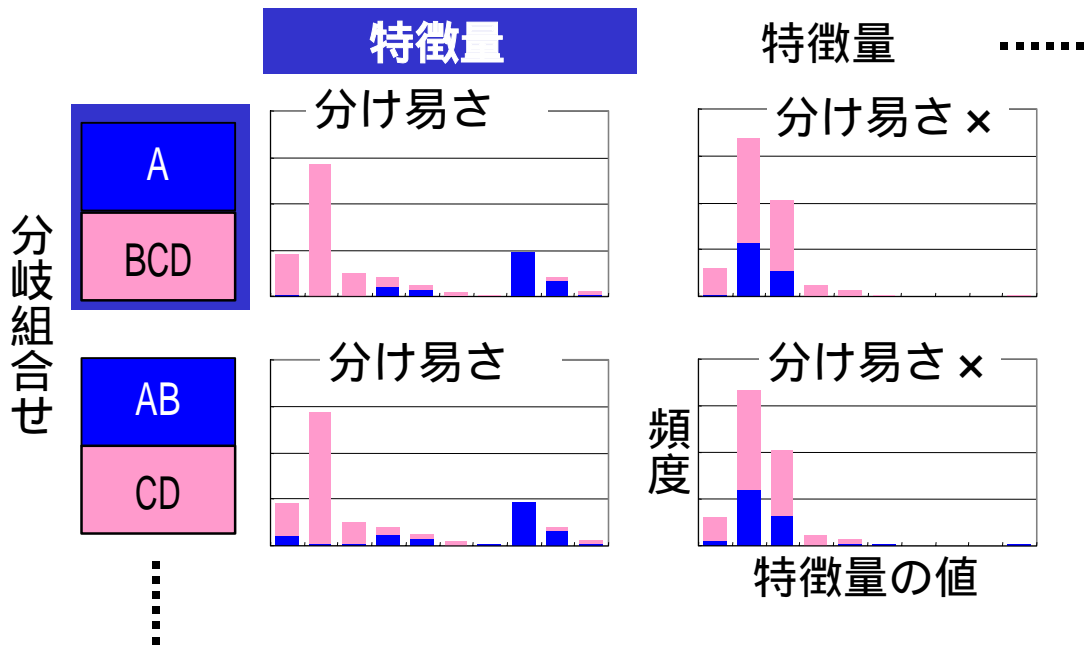


**決定木を利用した分類ルール自動生成術**  
 半導体ウェーハを対象としたリアルタイム欠陥分類  
 (株)日立製作所 / 渋谷久恵・岡部隆史・中川泰夫



第 1 図 半導体ウェーハ外観検査方式



第 3 図 特徴量と 2 分岐の組合せ決定方法